

参加
無料

サーモフィッシャーサイエンティフィック XPS・EDS ユーザーズフォーラム

今年も XPS・EDS ユーザーズフォーラムを開催する運びとなりました。日頃製品をご愛顧いただいている多くのお客様に対し、ユーザー様の実際の事例や、皆様の日頃のお仕事に役立つ情報をご紹介致します。今後、当社製品をより有効にお使いいただき、お仕事がますます発展するための機会となりましたら幸いです。ご多忙中とは存じますが、ご参加をお待ち申し上げます。

日時： 2015年7月8日(水) 13:00～19:00 ※12:30より受付開始
会場： 東京コンファレンスセンター・品川

| 時間 | 内容 | 概要 |
|-------------|---|---|
| 13:00～13:10 | ごあいさつ | |
| 13:10～13:50 | 招待講演① 「表面分析の進歩とポイント、そして、 分析の未来」 ジャパン・リサーチ・ラボ 代表 奥村治樹 様 | 現在において表面は、関わりのない技術は無いと言えるほどに重要なものである。このため、XPSを中心として様々な分析技術が開発されてきた。しかし、黎明期のような技術的ブレークスルーは難しい現状に対して、開発現場からの要求はさらに高度なものとなってきている。 本講演では、様々な基盤技術を支える表面分析の代表である XPS を軸として、その進歩、活用ポイントと共に、今後の更なる分析技術の発展の方向である「Pre-分析」、「Post-分析」について述べる。 |
| 13:50～14:10 | サーモフィッシャーサイエンティフィック講演① 「XPS ワンポイント講座！（デブスプロ ファイル編）」 | 薄膜や多層膜の深さ方向の情報を取得するために、Ar イオン銃や Ar ガスクラスタイオン銃を用いてデブスプロファイル測定を行うことは、XPS では常套手段となっています。デブスプロファイル測定ではイオン銃の設定だけではなく、スパッタ時間やラスターサイズ、試料面内回転など複雑な各種の設定があります。本講演では、詳細な条件設定や測定に関するコツ、ノウハウなどを解説します。 |
| 14:10～14:40 | 招待講演② 「XPSを取り入れたチーグラール・ナッタ触媒 の構造解明」 東邦チタニウム株式会社 齋藤雅由 様 | ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)は世界の5大汎用樹脂として、我々の生活には欠かせない樹脂である。PEとPP樹脂用触媒に代表される塩化マグネシウム/四塩化チタン担持(チーグラール・ナッタ)触媒の構造解明は世界の研究機構で精力的に行われている。とりわけ触媒中のチタン原子はPE、PPを発現させるため重要な原子であり、この状態を把握するのは大変重要である。今回我々はXPSを用いて、触媒中のチタン原子の変化等について検討したので報告する。 |
| 14:40～16:00 | ポスターセッションと技術相談会 | ユーザー様からの最新研究のご紹介、弊社アプリケーション部門からの最新測定事例などの発表を行います。 並行して技術相談会を行いますので、日頃 XPS・EDS を用いた分析でお困りのこと、ちょっと聞いてみたいことなど、お気軽にご相談ください。 |
| 16:00～16:35 | 招待講演③ 「表面および界面の EDX を用いた微細構造 解析」 JFE テクノリサーチ株式会社 ソリューション本部 ナノ材料評価センター 櫻田委大 様 | ULV-SEM(極低加速電圧 SEM)と EDX 分析(Thermo Scientific Ultra Dry Silicon Drift Detector)の組み合わせで見える、電子材料、薄膜・表面処理材料、微粒子など各種材料におけるナノレベルの微細構造の高分解能分析例をご紹介します。 |
| 16:35～16:55 | サーモフィッシャーサイエンティフィック講演② 「COMPASS を利用した EDS スペクトル イメージングデータの解析手順と最新 型超高立体角シリコンドリフト検出器 のご紹介」 | 大口径シリコンドリフト検出器の登場によって、EDS マップデータの収集時間は飛躍的に短縮されましたが、そのデータ解析に要する労力と時間が作業コストの大きな割合を占めています。今回、PM2.5 粒子のデータ(ご提供: 大阪大学、大阪府立環境農林水産総合研究所様)を実例として、COMPASS(多変量イメージ解析ソフトウェア)を使って未知試料のスペクトルイメージングデータを効率よく解析する手順をご説明します。 検出器の先端形状に工夫を凝らし、立体角を飛躍的に向上させた最新型シリコンドリフト検出器(FESEM 用)についてもご紹介します。 |
| 16:55～17:30 | 招待講演④ 「原子分解能 STEM-EDS の原理と手法」 東京大学 大学院工学系研究科・総合研究機構 特任研究員 熊本明仁 様 | エネルギー分散型 X 線分光法(EDS)は、シリコンドリフト検出器(SDD)を採用することで、試料中の酸素や窒素の軽元素を含めた含有元素を同時検出することを可能にしている。現在、SDD-EDS と走査透過型電子顕微鏡法(STEM)を組み合わせた観察法が、原子スケールでの組成分布を得るための強力な分析ツールとなりつつあることから、本講演では、最近の原子分解能 STEM-EDS の撮像原理および複雑な統計処理を必要としない分析法の可能性について紹介する。 |
| 17:40～19:00 | 技術交流会(無料) | |

※ここに掲載されているプログラムは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●セミナーお申し込み方法●

当社 Web サイトよりお申し込みください。

http://www.thermoscientific.jp/content/tfs/ja_jp/about-us/events/07-xps-eds-users-forum-2015.html

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

●会場のご案内●

東京コンファレンスセンター・品川

〒108-0075 東京都港区港南1-9-36 アレア品川3F--5F

http://www.tokyo-cc.co.jp/access_shinagawa.html

最寄駅:JR 品川駅港南口(東口)から徒歩 2 分

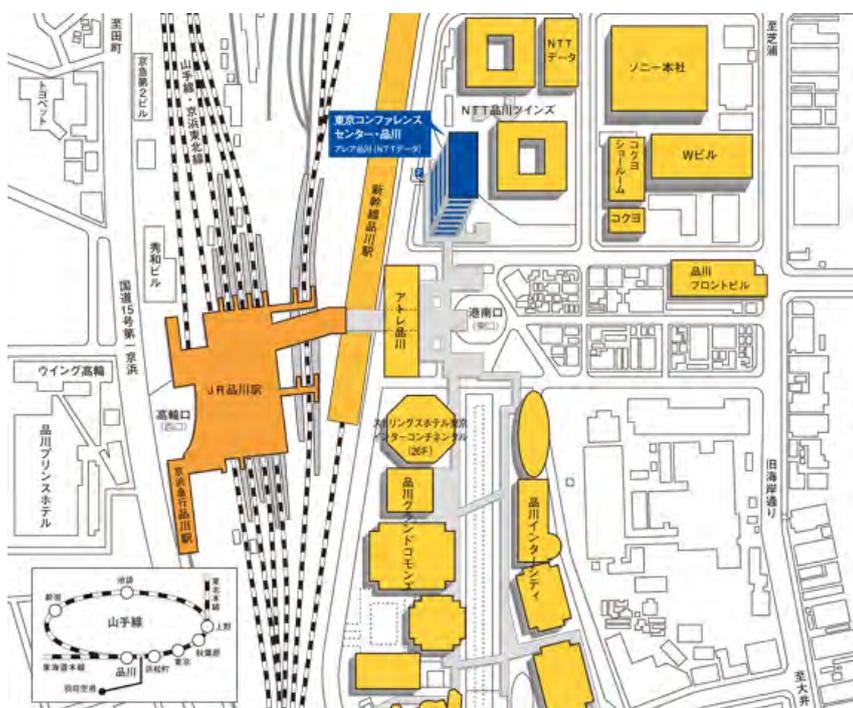
●お問い合わせ●

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL 0120-753-670 FAX 0120-753-671

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町 3-9

E-mail: Seminar.jp@thermofisher.com



※ このご案内は次のお客様を対象として、弊社の新製品、サービス、セミナーに関するお知らせのためにお送りしています。

●過去に弊社製品をご購入、ご使用中のお客様、または新規購入をご検討中のお客様

●過去の展示会や弊社セミナーなどにご来場いただいたお客様

※今後、このようなご案内がご不要の場合、お手数ですが、Seminar.jp@thermofisher.com まで「XPSEDSUF」とご明記の上、お知らせください。